



International Nanotechnology Exhibition & Conference

# nano tech 2018 出展のご案内

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社は2月14日(水)～16日(金)にて東京ビッグサイトで開催される「nano tech 2018」に於いて、スイスパビリオン内にて弊社測定機およびTRIMOS社製測定機を出展いたします。

ご多忙中の所、誠に恐縮に存じますが、この機会に是非ご来臨賜り、ご高覧いただきたくご案内申し上げます。

敬具

\*\*\*\*\* 記 \*\*\*\*\*

会 期：2018年2月14日(水)～2月16日(金)

開 催 時 間：10:00～17:00

場 所：東京ビッグサイト

出展ブースNo：東4-6ホール 5S-13 (スイスパビリオン内)

## 《展示品》

### ◆分散性 自動検査装置 [ADIM]

- ・ グラインドゲージ(粒度ゲージ)と組み合わせて、練り製品の添加粒子や素材粒子の大きさと分散具合を測定します。
- ・ 掻取機能を自動にする事で、同一条件での掃引を実現。
- ・ JIS K 5600-2-5 に準拠した判定方法で、粒子の分散性、練りの程度を評価します。



### ◆TRIMOS社製 横型測長機 [THV]

- ・ 小径ゲージ等の校正と保証用に設計。簡単操作で高精度測定が可能。
- ・ 小型で持ち運びが容易。工場現場での使用に理想的。
- ・ EN ISO9000規格の要求をすべて満たしています。
- ・ 絶対測定範囲：50mm、最大測定範囲：100mm
- ・ 最大許容誤差： $(0.2+L(\text{mm}))/250$   $\mu\text{m}$ 、繰返し精度(2S)：0.1 $\mu\text{m}$



### ◆TRIMOS社製 高性能縦型測長機 [V9]

- ・ 加工現場で誰でも簡単に高精度測定が可能。
- ・ 一方向ではなく上下両方向の最大許容誤差(BMPE)において世界最高クラス。
- ・ PCDや穴と穴のダイレクト距離、穴角度等の二次元測定が簡単に測定可能。
- ・ 測定範囲：1109mm (V9-1100)
- ・ 上下両方向の最大許容誤差(BMPE)： $(1.2+L(\text{mm}))/1000$   $\mu\text{m}$
- ・ 繰返し精度(2S)：平面：0.5 $\mu\text{m}$ 、R面：1 $\mu\text{m}$



※上記出展品は、都合により予告なく変更になる場合があります。

本社営業所：〒947-0044 新潟県小千谷市大字坪野 826 番地 2

TEL：0258-84-3911 FAX0258-81-2113 E-mail：info@issoku.jp

東京営業所：〒110-0015 東京都台東区東上野 2 丁目 13 番地 12 M&Mビル 7 階

TEL：03-5812-6722 FAX：03-5812-6725 E-mail：tokyo@issoku.jp